Search Notes

Application/C	ontrol No.	Applicant(s) Reexaminat	/Patent under ion
09/888,795		JIAN ET AL	
Examiner		Art Unit	
TAN TRINH		2684	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
455	67.13	6/1/2006	π		
·	556.1				
	114.3				
	144				
	194.2				
•	211				
375	396				
342	373				
327	356				

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
EAST	6/1/2006	π		
VO, NGUYEN	6/1/2006	π		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				